

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-22298-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 16.12.2022

Ausstellungsdatum: 16.12.2022

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-22298-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

IGMHS GmbH
Alter Hafen Süd 4, 18069 Rostock

Das Prüflaboratorium erfüllt die Mindestanforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

Rasterelektronenmikroskopie (REM) einschließlich Mikrobereichsanalyse (EDX) zur Bestimmung der Bruch- und Oberflächenmorphologie sowie von chemischen Elementen (außer Helium, Wasserstoff und Bor) an Feststoffen wie Schadensteilen, Bruchflächen, Pulvern und Partikeln, Schichtsystemen, geschweißten und gelöteten Proben metallischer sowie nichtmetallischer Werkstoffe;
Rasterelektronenmikroskopische (REM) Längen- und Schichtdickenmessung an Probenoberflächen unterschiedlicher Feststoffe;
Lichtmikroskopische Bildaufnahme zur Gefügebestimmung und Längen- und Schichtdickenmessung an Probenoberflächen unterschiedlicher Feststoffe

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-22298-01-01

Innerhalb der mit ** gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft.

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.**

1 Rasterelektronenmikroskopie (REM) einschließlich Mikrobereichsanalyse (EDX) zur Bestimmung der Bruch- und Oberflächenmorphologie sowie von chemischen Elementen (außer Helium, Wasserstoff und Bor) an Feststoffen wie Schadensteilen, Bruchflächen, Pulvern und Partikeln, Schichtsystemen, geschweißten und gelöteten Proben metallischer sowie nichtmetallischer Werkstoffe **

DIN ISO 22309 2015-11	Mikrobereichsanalyse-quantitative Analyse mittels energiedispersiver Spektroskopie (EDS) für Elemente mit der Ordnungszahl 11 (Na) oder höher
ASTM E 1508a 2012	Standard Guide for Quantitative Analysis by Energy-Dispersive Spectroscopy
AA-REM 1 2021-01	Spektrenaufnahme an kompakten Proben, Pulvern und Separaten mittels energiedispersiver Mikrobereichsanalyse (EDX)
AA-REM 6 2021-01	Elementverteilungsanalyse mittels REM/EDX an Oberflächen
AA-REM 7 2021-02	REM- und EDX-Untersuchungen an Bonit [®] -Qualitätsdropsen
AA-REM 9 2021-01	Konzentrationsprofil von chemischen Elementen mittels REM/EDX an Oberflächen
AA-REM 11 2021-01	REM- und EDX-Untersuchungen an DOTIZE [®] -Proben

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-22298-01-01

2 Rasterelektronenmikroskopische (REM) Längen- und Schichtdickenmessung an Probenoberflächen unterschiedlicher Feststoffe **

AA-REM 5 2021-01	Fertigungsbegleitende Routine-REM- und EDX-Untersuchungen an modifizierten Oberflächen
AA-REM 10 2021	Abbildung von Probenoberflächen mittels Sekundär- und Rückstreuелеktronen (SE, BSE) sowie Längenmessung an Partikeln in kompakten Proben einschließlich Schliffen, in Pulvern und Separaten - rasterelektronenmikroskopisches Verfahren (REM)

3 Lichtmikroskopische Bildaufnahme zur Gefügebestimmung und Längen- und Schichtdickenmessung an Probenoberflächen unterschiedlicher Feststoffe ***

DIN EN ISO 643 2020-03	Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korngröße
DIN EN ISO 945-1 2019-10	Mikrostruktur von Gusseisen - Teil 1: Graphitklassifizierung durch visuelle Auswertung
DIN EN ISO 1463 2004-08	Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung - Mikroskopisches Verfahren
ASTM E 112 Ausgabe: 2013	Bestimmung der mittleren Korngröße

Verwendete Abkürzungen:

ASTM	American Society for Testing Materials
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization (Internationale Organisation für Normung)
AA-REM	Hausverfahren der IGMHS GmbH